数电实验二: 门电路电特性测量

一、实验目的

- 在理解CMOS门电路的工作原理和特性基础上,学习并掌握其电特性主要参数的测试方法;
- 以CMOS与非门CD4011为例,进行电特性参数的测量和研究;
- 学习正确使用面包板和数字集成电路芯片。

二、实验内容

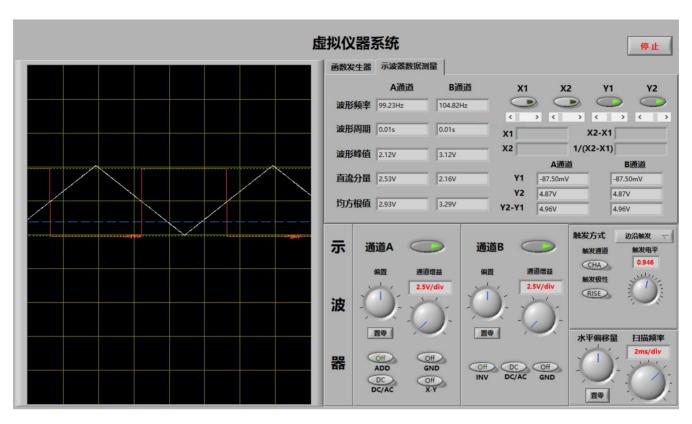
- 电压传输特性的测量。
- 传输延迟时间的测量。
- 瞬时导通功耗的观察。

三、测试方法和步骤

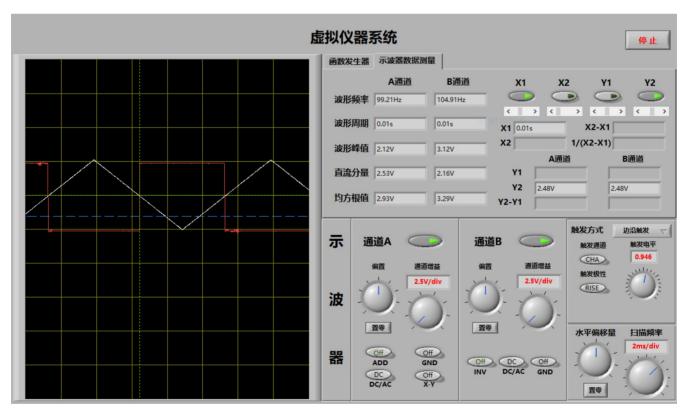
- 电压传输特性的测量。
 - 正确连接芯片(对芯片 CD4011, v_{DD接} 5V, v_{SS}接地);
 - 运行 MyLab 应用程序,利用 MyLab 的信号发生器,产生要求的信号 v_1 ,100Hz、0~5V 的三角波;
 - \circ 信号 v_1 和5V过与非门,输出过 $20k\Omega$ 的电阻接地,测量输出端电压信号 v_0 ;
 - 。 通过示波器观测输入、输出波形;
 - 。 对波形进行测量。
- 传输延迟时间的测量。
 - 正确连接芯片(对芯片 CD4011, v_{DD}接 5V, v_{SS}接地);
 - o 运行 MyLab 应用程序,利用 MyLab 的信号发生器,产生要求的信号 v_1 , 200kHz的TTL波;
 - \circ 信号 v_1 和 v_1 连过3个与非门,测量输出端电压信号 v_0 ;
 - 通过示波器观测输入、输出波形;
 - o 对波形进行测量。
- 瞬时导通功耗的观察。
 - \circ 正确连接芯片(对芯片CD4011, v_{DD} 接5V, v_{SS} 先过 $1k\Omega$ 电阻再接地);
 - o 运行 MyLab 应用程序,利用 MyLab 的信号发生器,产生要求的信号 v_1 ,10kHz、0~5V 的方波;
 - \circ 信号 v_1 和5V过与非门,将 v_{SS} 端口电压信号接示波器;
 - 。 通过示波器观测输入、输出波形;
 - 。 对波形进行测量。

四、实验数据记录及相应分析

• 实验1: 电压传输特性的测量。

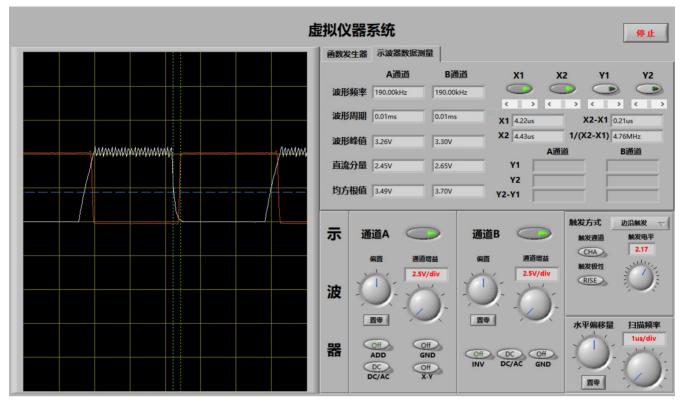


可以看到 $v_{OH}=4.87V$ $v_{OL}=-87.50mV$



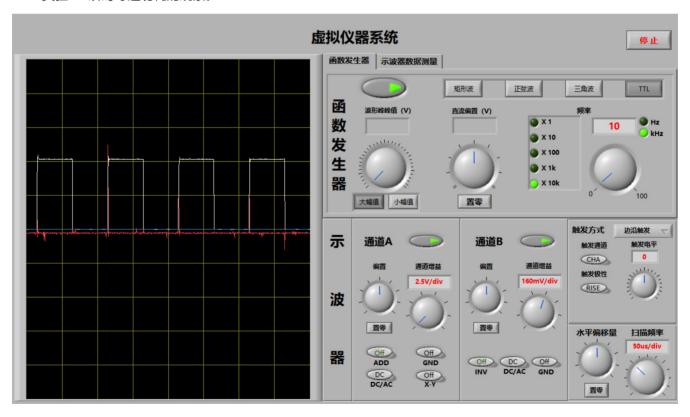
可以看到 $v_{TH}=2.48V$

• 实验2: 传输延迟时间的测量。



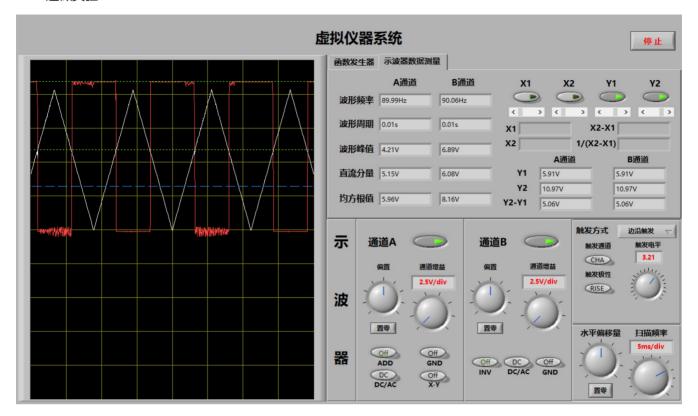
传输延迟时间 $t_{pd}=rac{0.21\mu s}{3}=0.07\mu s$

• 实验3: 瞬时导通功耗的观察。



如图,红线即为瞬时的电流。

• 选做实验:



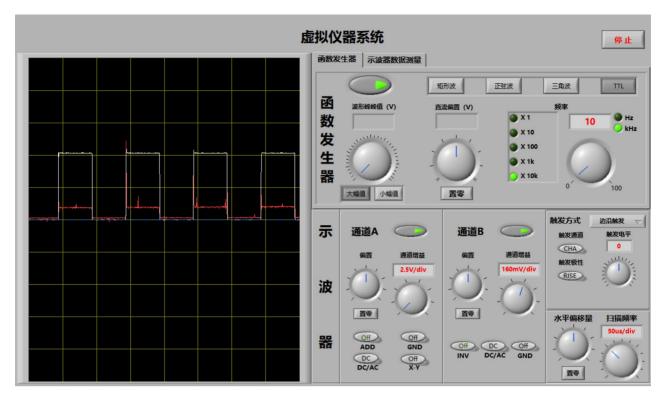
此时输入信号为0~10V的三角波,输出如图,可以看到 $v_{OH}=10.97V$ $v_{TH}=5.91V$

$$V_{NH} = V_{OH(min)} - V_{IH(min)} = 10.97 - 5.91 = 5.06V$$

 $V_{NL} = V_{IL(max)} - V_{OL(max)} = 5.91 - 0 = 5.91V$

较之前偏大的实验偏大,这是因为 v_{DD} 变高的原因。 $(v_{DD}$ 越高,噪声容限越大)

• 选做实验2:



将输入端悬空后,波形不稳定。这是因为输入端悬空,会受到感应信号干扰而误认为是有效输入信号,易出现 错误的输出。

五、在实验中遇到的问题及解决方法

在实验2:传输延迟时间的测量中

• 出现问题:接通之后,输出端的对应波形呈现一条水平直线。

• 原因查找过程:

- 。 将输出端接至过第一个与非门之后再测量, 此时出现不稳定且不理想的输出信号;
- 。 怀疑本芯片出现故障, 使用另外的芯片, 结果仍不变;
- 在老师的帮助下,意识到可能是因为采用了同一芯片的三个与非门导致了其互相影响。
- 解决方法: 换用三个芯片, 每个芯片只用一个与非门。
- 最终结果:实验结果正常。

六、实验体会

实验过程中并不是按部就班的按照课件做的,在实际实验过程中,可能会出现各种各样的意料之外的问题,必须分析问题所在并且想办法解决。

通过本次实验,我进一步理解了CMOS门电路工作原理,同时也熟练了示波器的使用。